Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio electrónico de transmisión por barrido (STEM), 50KV, 800000x B2-01-35-163-7230

Código: B2-01-35-163-7230

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Sistema de análisis automático rápido de imágenes de micropartículas

B2-01-35-163-7230 es un microscopio electrónico de transmisión de barrido (STEM) rápido, inteligente y totalmente automatizado, a 50KV, con derechos de propiedad intelectual totalmente independientes. Responde a las necesidades de aplicación en campos como la observación de la morfología de virus, las pruebas de seguridad de bancos de células para vacunas, la investigación y fabricación de vacunas, la investigación de cortes de tejido patológico clínico y la investigación biológica de la conectómica neuronal del cerebro.

◉ Sistema óptico electrónico de alta resolución y alto brillo

Imágenes de ultra alta velocidad de 100M/s a 50KV. El sistema tiene capacidad de análisis a nanoescala de nivel de video (25fps@2k*2k), lo que permite una adquisición de información totalmente automatizada y sin omisiones, manteniendo la alta resolución.

◉Detector directo de electrones de alta sensibilidad

Todos los detectores del B2-01-35-163-7230 usan detectores directos de electrones de diseño independiente, que convierten los electrones directamente en señales eléctricas, con una eficiencia de detección superior al 80% y una mayor relación señal/ruido (SNR).

◉Cambio rápido entre imágenes de campo amplio y de alta resolución

El diseño óptico electrónico innovador permite que la obtención de imágenes de campo amplio y la de alta resolución operen de forma independiente, lo que posibilita un cambio rápido, una identificación y un posicionamiento precisos de las partículas y una obtención rápida de imágenes de alta resolución.

◉Plataforma de movimiento mecánico de alta velocidad y alta estabilidad

Usa una plataforma de movimiento libre de vibraciones, X=±4mm, Y=±4mm, exactitud de posicionamiento 1um.

B2-01-35-163-7230 Microscopio electrónico de transmisión de barrido (STEM)	
Resolución	1,0nm@50kV
(corriente de haz de 1nA, en condiciones óptimas)	
Modo de imagen	BF/DF (campo claro/campo oscuro)
Voltaje de aterrizaje en modo STEM	50KV
Tipo de detector	Detector directo de semiconductor
Aumento	1X-500X (imágenes ópticas de bajo aumento)
	500X - 800.000X (imágenes STEM)
Cañón de electrones	Emisión de campo térmica tipo Schottky

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Corriente del haz de electrones	50pA a 100nA
Platina de muestras	X=±4mm, Y=±4mm, exactitud de posicionamiento 1um
Flujo de imágenes	Puede completar la obtención de imágenes de un área de 1x1mm² con píxel de 4nm en un plazo máximo de 0,5 horas
Adquisición de imágenes de ultra alta velocidad	100MB/s; una sola imagen de 24k x 24k se captura en sólo 6,5s
Método de adquisición	Adquisición STEM en campo claro (BF) o campo oscuro (DF)
Software de control de microscopio electrónico de alto rendimiento	Equipado con optimización automática de imagen, seguimiento inteligente del enfoque, navegación óptica panorámica y funciones de adquisición de gran área totalmente automatizada
Cambio rápido entre imágenes de campo amplio y de alta resolución	Diseño óptico electrónico innovador, operación independiente de la obtención de imágenes de campo amplio y de alta resolución, cambio rápido, identificación y posicionamiento precisos de partículas, obtención rápida de imágenes de alta resolución
Servidor de IA para el software de procesamiento y análisis de imágenes	Imágenes de campo ultra amplio, 100um@25nm, servidor de IA con reconocimiento y medición de alta eficiencia
Capacidad de detección cuantitativa de partículas de alto rendimiento	Sistema de carga de muestras totalmente nuevo y sistema automatizado de gestión de muestras, que garantizan la detección cuantitativa

▶Sistema óptico diseñado para la detección totalmente automatizada de micropartículas

Los microscopios electrónicos de transmisión tradicionales tienen un campo visual pequeño, que no permite satisfacer las necesidades de detección e identificación de una gran cantidad de nanopartículas. El B2-01-35-163-7230 está diseñado con base en los conceptos de los equipos de detección por haz de electrones de grado industrial para semiconductores, y logra una capacidad de detección de nanopartículas de alto rendimiento.

El B2-01-35-163-7230 logra una obtención de imágenes de ultra alta velocidad mediante diseños innovadores como la tecnología de imagen rápida, la platina de muestras libre de vibraciones, el sistema óptico electrónico de alta velocidad y la tecnología de IA, con velocidades de imagen que alcanzan decenas de veces las de los microscopios electrónicos tradicionales.

▶Diseño totalmente automatizado

Una serie de acciones como la inspección de encendido, el posicionamiento por navegación, el centrado con un clic, el ajuste de enfoque y la corrección de desplazamiento están automatizadas. El sistema de seguimiento de enfoque en tiempo real está compuesto por hardware y software. Usa una deflexión electrónica precisa para lograr un posicionamiento exacto de las imágenes de la muestra, lo que da una alta repetibilidad de los resultados. No sólo elimina el gran esfuerzo de ajustar y ubicar las posiciones de la muestra, sino que además usa inteligencia artificial para la detección automática, lo que permite finalmente una operación continua sin supervisión.

▶Funciones de software personalizables para distintos clientes

Aprovecha la inteligencia artificial moderna, algoritmos de IA, etc., para asistir al personal experimental en el análisis, desde la preparación de muestras en la etapa inicial hasta la obtención automática de imágenes de cortes completos y su unión por el microscopio electrónico, la generación de mapas de alta resolución y luego el procesamiento de datos en la etapa final. El análisis inteligente con IA puede usarse para la detección y clasificación automáticas de partículas, entregando a los usuarios una solución completa.

Imágenes				
N.º de modelo	**B2-01-35-163-7230**			
Otras especificaciones	Bomba turbomolecular 240L/S, bomba mecánica 12m3/H			

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Accesorio opcional	B2-01-35-150-7001 BSE B2-01-35-150-7002 EDS B2-01-35-150-7011 Recubridor iónico por pulverización catódica			
Sistema compatible	Win10			
Luz transmitida	Cartucho de filamento de tungsteno, voltaje 1~30KV			
Platina de trabajo	Platina manual de 3 ejes X/Y/R, diámetro máx. de muestra 370mm, altura máx. 68mm			
Desplazamiento de la platina de trabajo	100x100x60mm			
Tamaño de la platina de trabajo	Platina automática estándar de 3 ejes			
Tipo de platina de trabajo	Platina motorizada			
Objetivo	Detector SE+CCD			
Aumento estándar	1x~2000000x			
Características	Platina motorizada			

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.

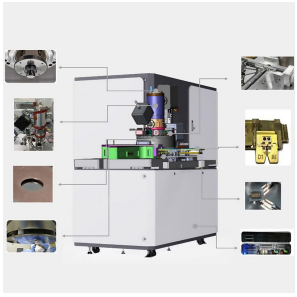


Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización